

走査型白色干渉顕微鏡 解析支援ツールのご紹介

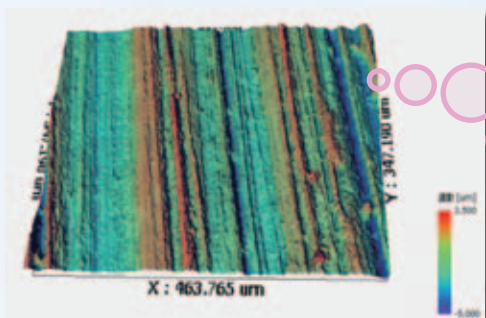
VS1000 Series

Coherence Scanning Interferometry

ISO 25178 3D表面性状パラメータ 比較ツール



VS1000シリーズは 形状による違いの定量化をサポートします



走査型白色干渉顕微鏡VS1000シリーズ測定例

走査型白色干渉顕微鏡は、三次元表面性状の国際標準規格ISO 25178に規定されている測定手法の一つです。VS1000シリーズでは、ISO 25178に準拠しており、比較ツールを用いることでパラメータ選択を簡単サポートいたします。

お困りではありませんか？

- SaやRaといった一般的な粗さパラメータだけではサンプル間の違いが数値化できない
- ISOパラメータは知っているが、それぞれのサンプル評価に適したパラメータがわからない

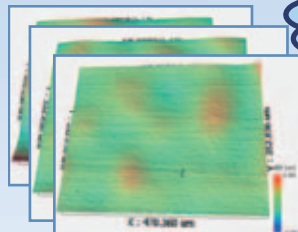
3D表面性状パラメータ ISO 25178

カテゴリ	パラメータ
高さパラメータ	Sq Ssk Sku Sp Sv Sz Sa
空間パラメータ	Sal Str Std
複合パラメータ	Sdq Sdr
機能パラメータ	Sk Spk Svk SMr1 SMr2 Svq Spq Smq Sxp
体積パラメータ	Vvv Vvc Vmp Vmc
フラクタルパラメータ	Safc SRC
形態パラメータ	Spd Spc S5p S5v S10z

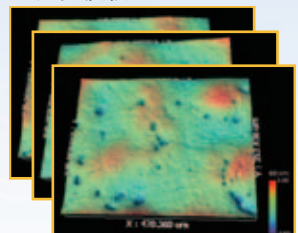
多数ある3D表面性状パラメータ ISO 25178 適切なパラメータ選択をサポートする機能

線粗さ評価だけでは違いが分かりづらい試料において、面全体の評価を行うことで試料間の違いの定量的な評価を可能にします。

超光沢紙A Sa 49.1 nm



超光沢紙B Sa 49.3 nm



形状の違いはあるのに
定量化が難しい...

